

Compatibilité électromagnétique (CEM) –

Electromagnetic compatibility (EMC) –

Partie 4-30: Techniques d'essai et de  
mesure – Méthodes de mesure de  
la qualité de l'alimentation

Part 4-30: Testing and measurement  
techniques – Power quality measurement  
methods

## CORRIGENDUM 1

Page 18

### 4.1 Classes de méthodes de mesure

*Au lieu de :*

Pour que des résultats concordants soient obtenus, les appareils de classe A exigent une caractéristique de largeur de bande passante et une fréquence d'échantillonnage suffisantes pour la précision spécifiée de chaque paramètre.

*lire :*

Pour que des résultats concordants soient obtenus, les performances de la classe A exigent une caractéristique de largeur de bande passante et une fréquence d'échantillonnage suffisantes pour la précision spécifiée de chaque paramètre.

Page 20

### 4.4 Agrégation des intervalles de temps de mesure

*Au lieu de :*

- intervalle de 3 s (150 périodes pour une fréquence nominale de 50 Hz ou 180 périodes pour une fréquence nominale de 60 Hz),

*lire :*

- intervalle de 150/180 périodes (150 périodes pour une fréquence nominale de 50 Hz ou 180 périodes pour une fréquence nominale de 60 Hz),

Page 19

### 4.1 Classes of measurement performance

*Instead of:*

To ensure that matching results are produced, class A performance instrument requires a bandwidth characteristic and a sampling rate sufficient for the specified uncertainty of each parameter.

*read:*

To ensure that matching results are produced, class A performance requires a bandwidth characteristic and a sampling rate sufficient for the specified uncertainty of each parameter.

Page 21

### 4.4 Measurement aggregation over time intervals

*Instead of:*

- 3-s interval (150 cycles for 50 Hz nominal or 180 cycles for 60 Hz nominal),

*read:*

- 150/180-cycle interval (150 cycles for 50 Hz nominal or 180 cycles for 60 Hz nominal),

Page 22

#### 4.6 Incertitude d'horloge Note 3

*Au lieu de :*

... deux instruments de Classe A...

*lire :*

... deux instruments utilisant les méthodes de la Classe A ...

Page 26

#### 5.3.3 Évaluation des mesures

*Au lieu de :*

Les creux, les surtensions temporaires à fréquence industrielle et les coupures de tension doivent entraîner le marquage des valeurs de sortie  $P_{st}$  et  $P_{lt}$  ainsi que des valeurs de «sortie 4 et 5» (voir CEI 61000-4-15).

*lire:*

Les creux, les surtensions temporaires à fréquence industrielle et les coupures de tension doivent entraîner le marquage des valeurs de sortie  $P_{st}$  et  $P_{lt}$  (voir CEI 61000-4-15).

Page 36

#### 5.8 Harmoniques de tension

*Au lieu de :*

$C_{ng}$

*lire:*

$G_{sg,n}$

Page 36

#### 5.9 Interharmoniques de tension

*Au lieu de:*

$C_{n-200-ms}$

*lire:*

$C_{isg,n}$

Page 23

#### 4.6 Time-clock uncertainty Note 3

*Instead of:*

... two Class A instruments...

*read:*

... two instruments using Class A methods...

Page 27

#### 5.3.3 Measurement evaluation

*Instead of:*

Voltage dips, swells, and interruptions shall cause  $P_{st}$  and  $P_{lt}$  output values as well as "output 4 and 5 values" (see IEC 61000-4-15), to be flagged.

*read:*

Voltage dips, swells, and interruptions shall cause  $P_{st}$  and  $P_{lt}$  output values (see IEC 61000-4-15) to be flagged.

Page 37

#### 5.8 Voltage harmonics

*Instead of:*

$C_{ng}$

*read:*

$G_{sg,n}$

Page 37

#### 5.9 Voltage interharmonics

*Instead of:*

$C_{n-200-ms}$

*read:*

$C_{isg,n}$

### 5.10.1 Mesure

*Au lieu de:*

Les valeurs mesurées sont enregistrées pendant un temps spécifié par l'utilisateur afin de donner le niveau et la séquence du signal.

*lire :*

Les valeurs mesurées sont enregistrées pendant un temps spécifié par l'utilisateur afin de donner le niveau maximum du signal.

### 6.1 Domaine de variation des grandeurs d'influence Tableau 1 Ligne 2, Colonne 2

*Au lieu de:*

0 % – 200 % de  $U_{din}$

*lire :*

1 % – 200 % de  $U_{din}$   
(Pour la fréquence, utiliser 10 % - 200 % de  $U_{din}$ )

### 6.2 Vérification de la réalisation des méthodes de mesure

*Au lieu de :*

- maintenir toutes les autres grandeurs dans les conditions d'essai 1 et vérifier l'incertitude de mesure de la grandeur à tester en 5 points équidistants du domaine des grandeurs d'influence (par exemple, 0 % de  $U_{din}$ , 50 % de  $U_{din}$ , 100 % de  $U_{din}$ , 150 % de  $U_{din}$ , 200 % de  $U_{din}$  pour la classe A) ;

### 5.10.1 Measurement

*Instead of:*

The measured values are recorded during a period of time specified by the user, in order to give the level and the sequence of the signal voltage.

*read:*

The measured values are recorded during a period of time specified by the user, in order to give the maximum level of the signal voltage.

### 6.1 Range of influence quantities Table 1 Row 2, Column 2

*Instead of:*

0 % – 200 % of  $U_{din}$

*read:*

1 % – 200 % of  $U_{din}$   
(For frequency use 10 % - 200 % of  $U_{din}$ )

### 6.2 Implementation verification

*Instead of:*

- holding all other quantities in testing state 1, verify the uncertainty of the measured quantity to be tested at 5 equally spaced points throughout the range of influence quantity (for example, 0 % of  $U_{din}$ , 50 % of  $U_{din}$ , 100 % of  $U_{din}$ , 150 % of  $U_{din}$ , 200 % of  $U_{din}$  for class A);

*lire:*

- maintenir toutes les autres grandeurs dans les conditions d'essai 1 et vérifier l'incertitude de mesure de la grandeur à tester en 5 points approximativement équidistants du domaine des grandeurs d'influence (par exemple, 1 % de  $U_{din}$ , 50 % de  $U_{din}$ , 100 % de  $U_{din}$ , 150 % de  $U_{din}$ , 200 % de  $U_{din}$  pour la classe A) ;

*read:*

- holding all other quantities in testing state 1, verify the uncertainty of the measured quantity to be tested at 5 approximately equally spaced points throughout the range of influence quantity (for example: 1 % of  $U_{din}$ , 50 % of  $U_{din}$ , 100 % of  $U_{din}$ , 150 % of  $U_{din}$ , 200 % of  $U_{din}$  for class A);

Page 44

**6.2**  
**Tableau 3**  
**Ligne 4, Colonne 3**

*Au lieu de :*

0,73 % ± 0,5 % de $U_{din}$	Phase A
0,80 % ± 0,5 % de $U_{din}$	Phase B
0,87 % ± 0,5 % de $U_{din}$	Phase C

*lire:*

73 % de $U_{din} \pm 0,5$ %	Phase A
80 % de $U_{din} \pm 0,5$ %	Phase B
87 % de $U_{din} \pm 0,5$ %	Phase C

Page 44

**6.2**  
**Tableau 3**  
**Ligne 4, Colonne 4**

*Au lieu de :*

1,52 % ± 0,5 % de $U_{din}$	Phase A
1,40 % ± 0,5 % de $U_{din}$	Phase B
1,28 % ± 0,5 % de $U_{din}$	Phase C

*lire:*

152 % de $U_{din} \pm 0,5$ %	Phase A
140 % de $U_{din} \pm 0,5$ %	Phase B
128 % de $U_{din} \pm 0,5$ %	Phase C

Page 45

**6.2**  
**Table 3**  
**Row 4, Column 3**

*Instead of:*

0,73 % ± 0,5 % of $U_{din}$	Phase A
0,80 % ± 0,5 % of $U_{din}$	Phase B
0,87 % ± 0,5 % of $U_{din}$	Phase C

*read:*

73 % of $U_{din} \pm 0,5$ %	Phase A
80 % of $U_{din} \pm 0,5$ %	Phase B
87 % of $U_{din} \pm 0,5$ %	Phase C

Page 45

**6.2**  
**Table 3**  
**Row 4, Column 4**

*Instead of:*

1,52 % ± 0,5 % of $U_{din}$	Phase A
1,40 % ± 0,5 % of $U_{din}$	Phase B
1,28 % ± 0,5 % of $U_{din}$	Phase C

*read:*

152 % of $U_{din} \pm 0,5$ %	Phase A
140 % of $U_{din} \pm 0,5$ %	Phase B
128 % of $U_{din} \pm 0,5$ %	Phase C

Page 68

**A.5.4 Harmoniques de courant**

*Au lieu de:*

$C_{ng}$

*lire :*

$G_{sg,n}$

Page 68

**A.5.5 Interharmoniques de courant**

*Au lieu de:*

$C_{n-200-ms}$

*lire:*

$C_{isg,n}$

Page 69

**A.5.4 Harmonic currents**

*Instead of:*

$C_{ng}$

*read:*

$G_{sg,n}$

Page 69

**A.5.5 Interharmonic currents**

*Instead of:*

$C_{n-200-ms}$

*read:*

$C_{isg,n}$